



Desafíos de confiabilidad en dispositivos MOS y circuitos integrados de radiofrecuencia

Presente y futuro de la tecnología electrónica

El paradigma de la miniaturización se ha encontrado con limitaciones, tanto económicas como tecnológicas, que atentan contra la mejora sostenida del rendimiento de los circuitos electrónicos. Garantizar la confiabilidad tanto a nivel físico de la estructura de un transistor como también a nivel de su aplicación en circuitos elaborados, es un eslabón fundamental en el proceso de maduración de las tecnologías de integración.

El capítulo conjunto N° 3 EDS/SCC de la sección Argentina del IEEE lo invita a presenciar la charla “Desafíos de confiabilidad en dispositivos MOS y Circuitos integrados de frecuencia” por parte del Dr. en Ingeniería Sebastián Pazos

Fecha: *11D1C2021* Hora: *14hs* Duración: *40 min*

Inscripción: <https://events.vtools.ieee.org/m/291818>

Costo: *Gratis*

